

50 Jahre JEOL in Dresden - Jubiläums-Kolloquium -



Fraunhofer-Institutszentrum
Winterbergstraße 28
D-01277 Dresden

Montag | 28.11.2016

12:00	Come together & Registrierung
13:00 – 13:15	Begrüßung und Programmvorstellung M. Zimmermann, Fraunhofer IWS
13:15 – 14:00	50 Jahre JEOL in Dresden – Ein Exkurs durch 50 Jahre Werkstoffcharakterisierung J. Kaspar, Fraunhofer IWS
14:00 – 14:30	Entwicklung der Materialanalytik mit Elektronenstrahlen – ein Überblick heutiger Möglichkeiten M. Rodewald, JEOL(Germany) GmbH
14:30 – 15:00	Kombinierte in-situ Prüfung und Charakterisierung im REM A. Weidner, Bergakademie Freiberg

15:00 – 15:30 **Kaffeepause**

15:30 – 16:00	Heutige Möglichkeiten der EPMA und Leichtelementanalyse J. Börder, JEOL (Germany) GmbH
16:00 – 16:30	Gefüge als Multiskalenspeicher auf der Mikro-, Nano- und atomaren Skala F. Mücklich, Uni des Saarlandes
16:30 – 17:00	Werkstoffcharakterisierung am IWS M. Zimmermann, Fraunhofer IWS

17:00 – 18:00 **Labortour**
18:00 **Ende Veranstaltungstag**

19:30 **Abendessen Pulverturm**



www.jeol.de



JEOL (Germany) GmbH · Gute Änger 30 · 85356 Freising · Germany
Tel.: +49 8161 9845-0 · Fax: +49 8161 9845-100 · E-Mail: info@jeol.de

50 Jahre JEOL in Dresden - Jubiläums-Kolloquium -

Dienstag | 29.11.2016

9:00 – 9:30	REM und Präparation, Analyse im REM J. Heindl, JEOL (Germany) GmbH
9:30 – 10:00	Spezielle Methoden der Probenpräparation J. Meinhardt, Fraunhofer (ISC Würzburg)
10:00 – 10:30	Analytische Transmissionselektronenmikroskopie an funktionellen Oxiden A. Feldhoff, Universität Hannover

10:30 – 11:00 **Kaffeepause**

11:00 – 11:30 **Mapping local strain fields during in situ TEM deformation**

J. Eckert, Uni Leoben

11:30 – 12:00 **Challenges to Transmission Electron Microscopy in semiconductor industry**

H-J. Engelmann, GLOBALFOUNDRIES

12:00 – 12:45 **In-situ Charakterisierung am TEM**

P. Wachsmuth, JEOL (Germany) GmbH

12:45 – 13:30 **Mittagspause**

13:30 – 14:00 **Exploiting the analytical capabilities of the ARM**

E. Willinger, FHI Berlin

14:00 – 14:30 **Atomic Resolution Microscopy of Cage Materials**

R. Ramlau, Yu. Grin, MPI CPFS, Dresden

14:30 – 15:00 **Strain relaxation mechanisms at epitaxial heterojunctions**

R. Erni, EMPA Dübendorf

Änderungen vorbehalten

15:00 **Verabschiedung und Ende der Veranstaltung**

